

# EXTREME OBERFLÄCHE



## Neue Ausrüstung

### ToF-SIMS

Eine ToF-SIMS-Analyse ist eine Technik zur Analyse extremer Oberflächen mittels Massenspektroskopie, mit der die chemischen Bestandteile eines Materials auf der Nanometerskala identifiziert werden können. Diese Technik bietet eine hohe Auflösung, eine hohe Empfindlichkeit und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Probenoberfläche.

Unsere **hochmoderne Ausrüstung** ermöglicht

- Die Zusammensetzung einer Oberfläche/nenschichtung zu identifizieren
- Den Ursprung des Defekts genau zu bestimmen
- Die Integrität einer Oberflächenbehandlung oder Funktionalisierung zu validieren

- ### CHARAKTERISTIKEN IONTOF MS
- Informationsreichtum von 1 nm
  - Erhöhter räumliche Auflösung (bis zu 50 nm)
  - Elementare und molekulare Identifikation
  - Hohe Empfindlichkeit bis zu ppm
  - Für alle Arten von Materialien (auch hart)
  - Profilierung durch Ionen-Aggregate
  - Profil in der Dicke einer Multilayer
  - 3D-Kartierung
  - FIB-Schnitt 40°
  - Große Vielseitigkeit



Benennung der Ausrüstung,  
Interpretation der Ergebnisse  
Begleitung auf dem Weg zur Lösung

**Effizienz, Qualität, Lösung**

# November 2023



## MATERIA NOVA

Material Characterization  
Techniques

Kontakt |

[characterisations@materianova.be](mailto:characterisations@materianova.be)

[www.materianova.be](http://www.materianova.be)